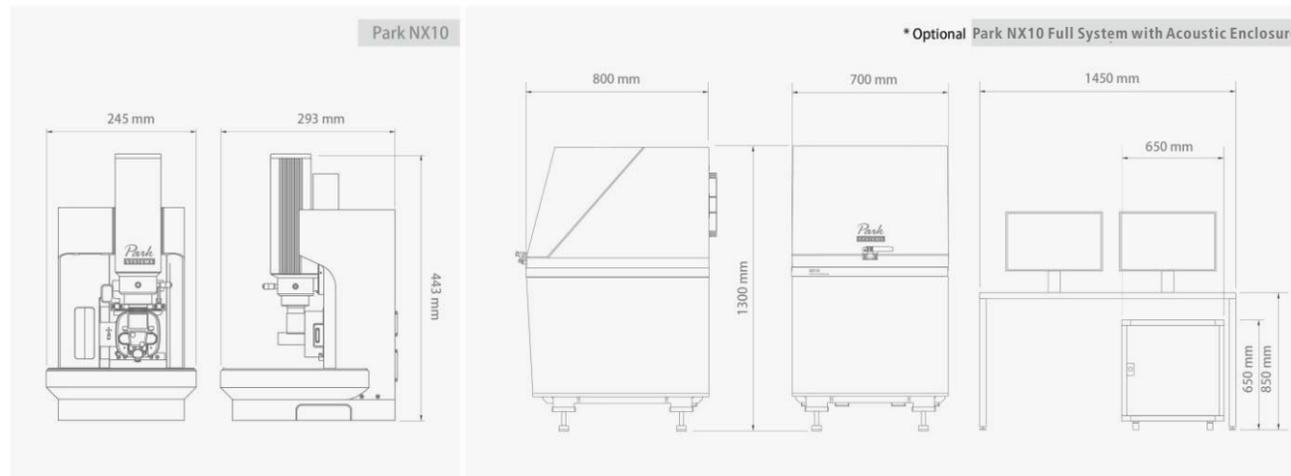


原子力显微镜

Park NX10

精准易用的原子力显微镜

扫描器	Z扫描器 AFM扫描头 柔性引导高推力扫描器 Z扫描范围: 15 μm (可选30 μm)	SICM扫描头 多层压电叠层的挠曲导向式结构 Z扫描范围: 15 μm (可选30 μm)	XY扫描器: 闭环控制的柔性引导XY扫描器 扫描范围: 50 μm x 50 μm (可选10 μm x 10 μm或100 μm x 100 μm)	驱动台 样品尺寸: 最大开放空间为100 mm x 100 mm, 厚度最大值为20 mm XY位移台行程范围: 20 mm x 20 mm Z位移台行程范围: 25 mm 聚焦样品台行程范围: 15 mm	
影像	样品表面和悬臂的直观同轴影像 视野: 480 μm x 360 μm (带10倍物镜) CCD: 120万像素 (默认), 500万像素 (可选; 视野: 840 μm x 630 μm)	物镜 10倍超长工作距离镜头 20倍高分辨率、长工作距离镜头	控制器 ADC: 18通道 X, Y和Z扫描器位置传感器的24位ADC DAC: 17通道 用于X, Y和Z扫描器定位的20位DAC	信号处理 ADC: 18通道 X, Y和Z扫描器位置传感器的24位ADC DAC: 17通道 用于X, Y和Z扫描器定位的20位DAC	综合功能 4通道灵活的数字锁相放大器 弹簧常数校准 (热控制法) 数字Q控制
选项/模式	形貌成像 · 非接触模式 · 接触模式 · 轻敲模式	磁学特性 · 磁力显微镜 (MFM)	介电/压电特性 · 压电响应力显微镜 (PFM) · 高压PFM · 压电响应谱	电学特性 · 导电原子力显微镜 (C-AFM) · 电流-电压分光谱 · 开尔文探针力显微镜 (KPFM) · 高压KPFM · 扫描电容显微镜 (SCM) · 扫描扩展电阻显微镜 (SSRM) · 扫描隧道显微镜 (STM) · 光电流测绘 (PCM) · 电流-距离 (I/d) 谱 (使用SICM) · 静电力显微镜 (EFM)	机械性能 · PinPoint纳米力学 · 力调制显微镜 (FMM) · 纳米压痕 · 纳米刻蚀 · 高压纳米刻蚀 · 纳米操纵 · 侧向力显微镜 (LFM) · 力距离 (F/d) 光谱 · 力体积成像
热性能	· 扫描热显微镜 (SThM)	化学特性 · 带功能化针尖的化学力显微镜 · 电化学原子力显微镜			
软件	Park SmartScan™ · AFM系统控制和数据采集软件 · 智能模式的快速设置和简易成像 · 手动模式的高级使用和更精密的扫描控制	XEI · AFM数据分析软件 · 独立设计—可以安装和分析AFM以外的数据 · 能够生成采集数据的3D绘制	配件 · 带温度控制的常用液池 · 温控台 · 电化学池	· 手套箱 · 磁场发生器 · 倾斜样品载台	



备注: 所有技术参数如有更改, Park将不个人另行通知, 请访问www.parksystems.cn中文网站查看最新技术参数。

致力于推动科学技术的发展

作为原子力显微镜的制造商, Park原子力显微镜(Park Systems)一直与时俱进, 竭诚为化学、材料、物理、生命科学、半导体和数据存储等行业的研究人员及工程师提供各系列产品。“真诚协助科学家和工程师解决紧迫的难题, 源源不竭推动科学发展, 坚持拓展工程创新的边界, 不断实现纳米级的进步”始终是Park原子力显微镜的使命。

发展至今, Park原子力显微镜不忘初心, 40年磨一剑, 其具有“True Non-Contact”模式和“PinPoint”纳米力学原子力显微镜, 以其长时的针尖寿命、简便易用的操作、精准高效的研究成果而成为业界领跑者。

目前, Park Systems 的客户已涵盖了大多数各国的半导体公司和亚洲、欧洲和美洲的国家的研究机构。Park原子力显微镜(Park Systems)是韩国证券交易所 (KOSDAQ) 的上市公司, 其总部位于韩国水原, 地区总部位于美国、墨西哥、德国、法国、英国、中国、日本、新加坡和印度。



Park原子力显微镜

持续坚持纳米科技创新进步



Park韩国总公司: +82-31-546-6800

Park德国: +49 (0) 621-490896-50

Park中国台湾地区: +886-3-5601189

Park美国: +1-408-986-1110

Park日本: +81-3-3219-1001

Park中国: +86 400-878-6829

Park东南亚: +65-66347470



Park NX10

纳米技术研究的理想选择

通过消除串扰进行准确的XY扫描

- 用于样品和探针的独立闭环XY和Z柔性扫描器
- 正交XY扫描
- 精准的高度测量，无需任何软件处理

低噪声Z检测器可精准测量原子力显微镜表面形貌

- 没有边缘过冲或压电蠕变误差的真实样品表面形貌
- 即便是高速扫描也可以保持精准的表面高度记录

True Non-Contact™模式可保证长久探针寿命，高分辨率和样品保护

- 快速的Z伺服速度可实现True Non-Contact™模式
- 针尖磨损更低，同时保证高质量和高分辨率成像

人性化设计的软件和硬件功能

- 开放式空间方便样品和探针更换
- 预对准的探针夹设计，可以轻易直观地实现激光对准
- Park SmartScan™- 原子力显微镜操作软件足以让初学者和资深用户都能进行专业的纳米级研究

Park NX10

原子力显微镜技术

无扫描器弓形弯曲的平直正交XY轴扫描

Park的串扰消除技术不仅改善了扫描器弓形弯曲的缺点，还能够不同扫描位置，扫描速率和扫描尺寸条件下进行平直正交XY轴扫描。即使平坦的样品也不会出现如光学平面,各种偏移扫描等曲率的背景。由此为顾客在研究中遇到的具有挑战性的问题提供高精度的纳米测量。



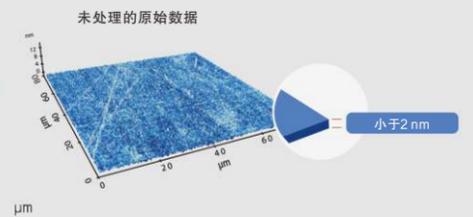
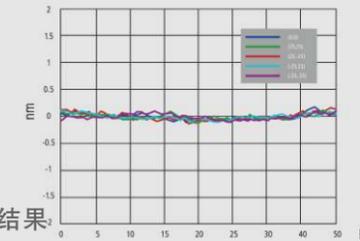
无耦合关系的XY和Z扫描器

Park和其他同类产品之间的根本区别在于扫描器架构。Park专有挠曲结构是基于独立XY扫描器和Z扫描器设计，可以获得高精度的纳米级分辨率数据。

精准的表面测量

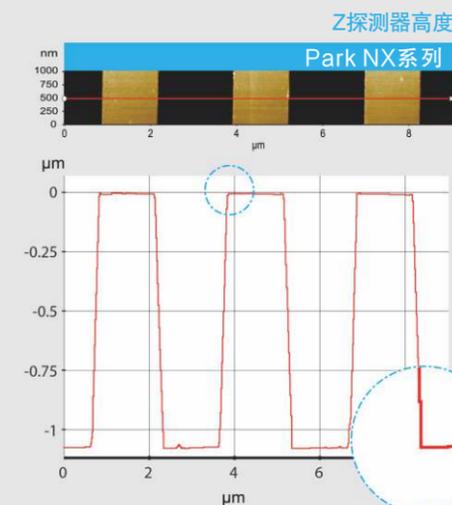
样品表面平直扫描!

- 低残余弓形弯曲
- 无需软件处理 (原始数据)
- 不受扫描位置影响也可获得精准的扫描结果



低噪声 Z 轴检测器

Park原子力显微镜配有有效的0.02 nm噪声带宽的低噪声 Z检测器，可满足测量高度精准的样品形貌，无边缘过冲，更无需校准。Park NX10既能为用户提供准确的测量数据又能为用户节省宝贵的时间。



无蠕变效应

通过低噪声Z轴检测器进行精准的样品形貌测量

- 用低噪声Z检测器对形貌发出信号
- 有高带宽, Z检测器低噪声只有0.02 nm
- 边缘位置无前沿或后沿过冲现象
- 只需在原厂校准一次

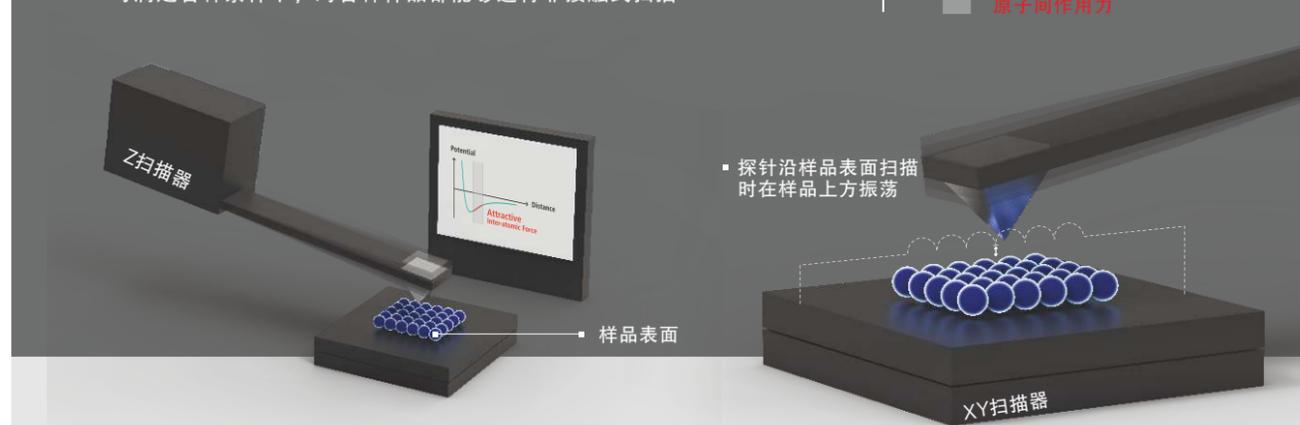
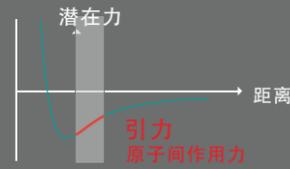
样品: 标称台阶高度1.2 μm
(9 μm x 1 μm, 2048 pixels x 128 lines)

True Non-Contact™模式

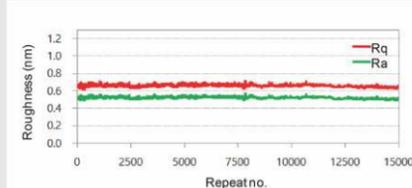
True Non-Contact™模式是Park原子力显微镜系统扫描模式，通过在扫描过程中防止针尖和样品损坏，从而产生高分辨率和准确的数据。

更快速的Z轴伺服使得真正的非接触式原子力显微镜有更精准的反馈

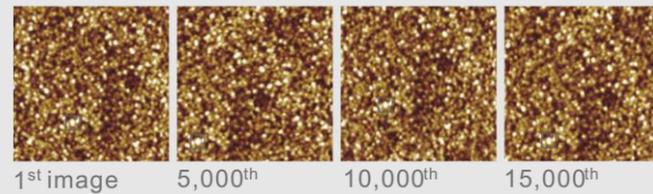
- 减少针尖磨损→长时间高分辨率扫描
- 无损式探针-样品接触→大限度减少样品受损程度
- 可满足各种条件下，对各种样品都能够进行非接触式扫描



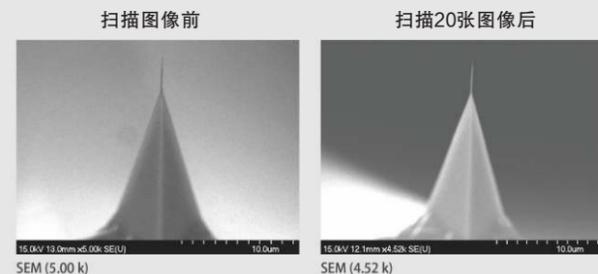
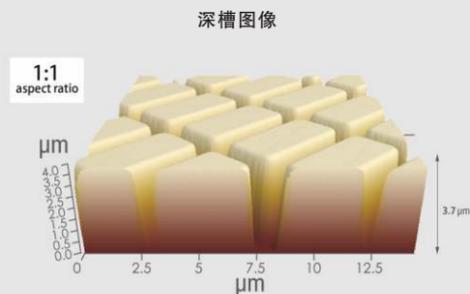
接触模式下，针尖在扫描过程中持续接触样品；轻敲模式下，针尖周期性地接触样品，而在非接触模式下针尖不会接触样品。因此，使用非接触模式具有几个关键特点。由于针尖锐度得以保持，在整个成像过程中会以高分辨率进行扫描。非接触模式下由于针尖和样品表面可以避免直接接触，避免损坏软样品。



Repeat	1 st	...	5000 th	...	10000 th	...	15000 th	Total Avg.	1σ (%)
Rq(nm)	0.669	0.674	0.665	0.642	0.662			0.662	0.011 (1.720%)
Ra(nm)	0.527	0.535	0.525	0.508	0.524			0.510	0.010 (1.835%)



此外，非接触模式可以感知探针与样品原子之间的作用力。探针接近样品时产生的横向力可以被检测。因此，在非接触模式下使用的探针可以避免撞到样品表面突然出现的高层结构。接触和轻敲模式只能进行探针底端力检测，很容易受到这种撞击伤害。



Park SmartScan™

SmartScan™自动模式下的单击成像

对于原子力显微镜成像，用户只需要指定原子力显微镜成像的像素密度和扫描尺寸。除这些因素之外，用户可以将一切复杂的原子力显微镜参数交由SmartScan™自动模式处理。系统将好的条件下开始测量，点击按钮后自动成像。



适用于科研和半导体用户的的原子力显微镜操作系统

无论用户的原子力显微镜需求集中在学术研究，工业计量还是故障分析，SmartScan的自动模式提供了一个简化的系统来生成高质量的原子力显微镜数据。此外，SmartScan™还可帮助初次使用AFM的研究人员进行富有成效的测量，从而在短时间内获得与专家操作者一样好的高质量数据。



FastApproach™

单击“位置”按钮，Z扫描器会自动接近样品，速度快于一般手动进针。Park的FastApproach™在不需要用户任何参与或干涉的情况下，在装载悬臂10秒后就能实现全速探测样品表面操作。



易于寻找目标区域

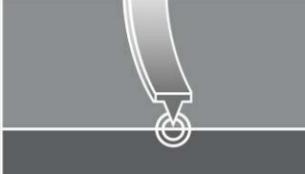
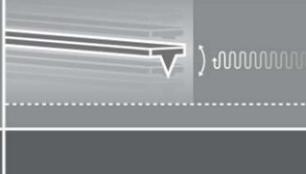
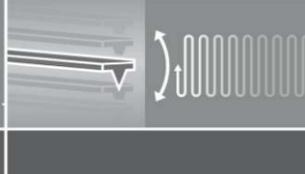
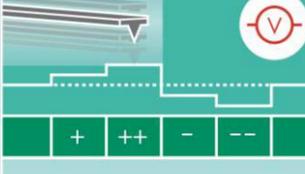
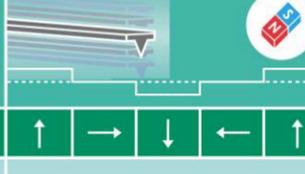
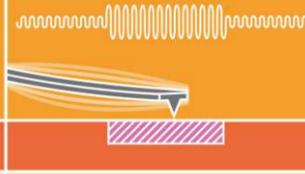
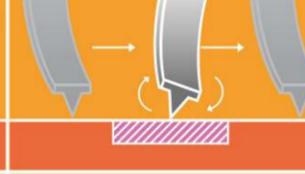
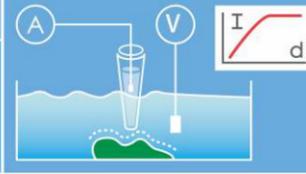
完成探针样品检测后，光学相机会自动聚焦在样品上，寻找目标区域(AOI)，通过控制集成光学窗口中的电动载物台，SmartScan™的用户体验可以轻松实现样品的直观导航。

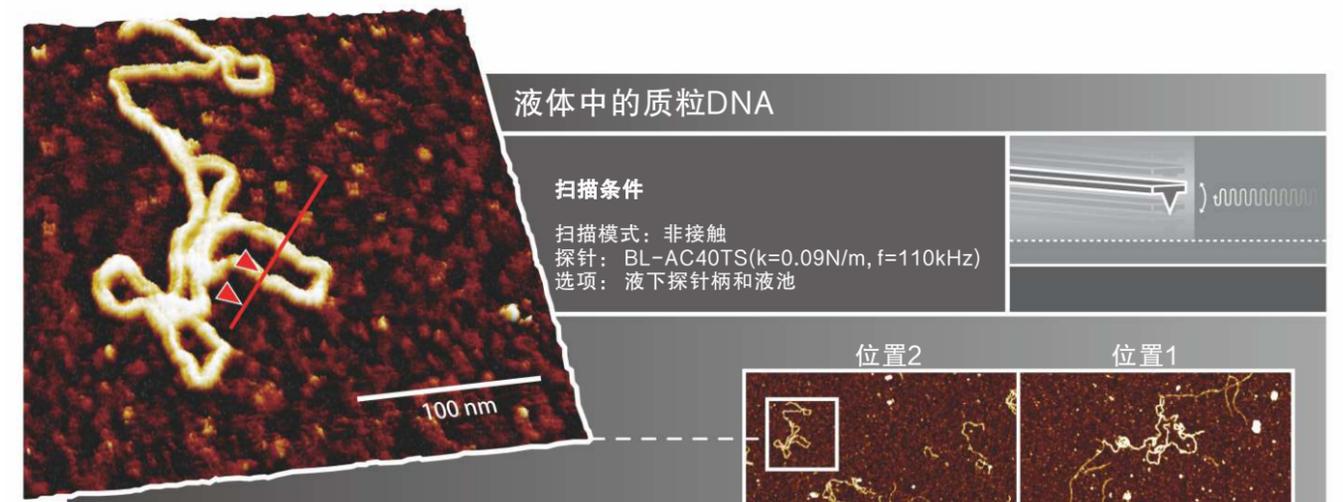
使用AdaptiveScan™加速成像

Park的创新 AdaptiveScan™ 根据样品表面的峰谷与谷值自动控制扫描速度。AdaptiveScan™通过断调整相应的扫描速度，以更高的速度获得未知形态的高质量图像。这与那些由经验丰富的专家手动操作相比，不仅有效地缩短了成像时间，同时也保证了高质量成像效果。无论是移动到周边位置或对准新目标，AdaptiveScan™都可以自动选择采用适配条件。

Park 原子力显微镜模式

通过选择Park的扫描模式得到您所需的数据

形貌成像				
	接触模式	非接触模式	轻敲模式	
电学/磁学特性				
	导电原子力显微镜	PinPoint导电原子力显微镜	电流-电压分光镜	光电流映射
				
	扫描隧道显微镜	扫描扩展电阻显微镜	扫描电容显微镜	静电力显微镜
				
	开尔文探针力显微镜	压电响应力显微镜	磁力显微镜	可调磁场显微镜MFM
纳米力学特性				
	力/距离光谱	PinPoint纳米力学	力调制显微镜	侧向力显微镜
				
	纳米压痕	纳米刻蚀	纳米操纵	
其他特性				
	扫描热显微镜	扫描离子电导显微镜		



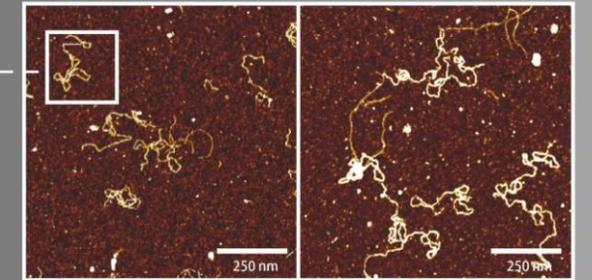
液体中的质粒DNA

扫描条件

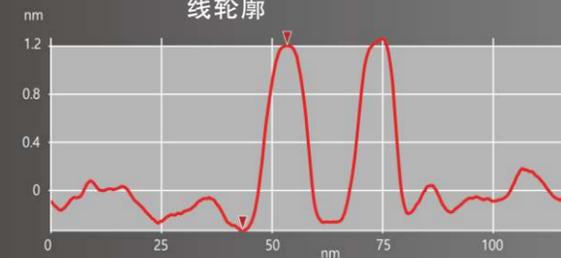
扫描模式：非接触
 探针：BL-AC40TS(k=0.09N/m, f=110kHz)
 选项：液下探针柄和液池

位置2

位置1



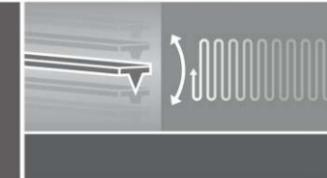
线轮廓



硅上聚合物

扫描条件

扫描模式：轻敲
 探针：AC160TS(k=26N/m, f=300kHz)



ITO玻璃

扫描条件

扫描模式：导电原子力显微镜
 探针：CDT-Contr(k=0.5N/m, f=20kHz)

